



PHYSICAL ELECTRONICS GMBH

Neu in
unserem Labor
AES

NanoX-Pert BIG 3 in Surface Science

Im Fokus:

Oberflächen und Grenzflächenanalytik mit Auger Elektronen Spektroskopie (AES), XPS & TOF-SIMS

Interdisziplinäre Technologien für die komplexen und zukunftsweisenden Forschungs- und Entwicklungsfelder der Materialwissenschaften und Werkstoffkunde

Leitung: Stefan Reichlmaier

Termin: 07.10.2020

Ort: 85622 Feldkirchen bei München, Salzstraße 8

Physical Electronics GmbH



PHI GmbH's INHOUSE Seminare 2021:

Sharing X-Perience mit NanoX-Pert

NanoX-Pert NanoScience (April 2021)

NanoX-Pert Life Science (Oktober 2021)

Das Seminar ist kostenlos, inklusive Catering und Informationsmaterial. Zur Teilnahme müssen alle Teilnehmer registriert sein.

Registrierung mittels E-Mail: szauzig@phi-europe.com

Registrierung bis 18.09.2020

Name

Firma

Abteilung/Position

Straße

PLZ; Ort

Tel./Fax

E-Mail

Die Datenschutzerklärung <https://phi-gmbh.eu/privacy-policy/> habe ich zur Kenntnis genommen.

Speicherung der Daten

- Ja, hiermit bestätige ich das Physical Electronics GmbH im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für uns geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen, meine persönlichen Daten elektronisch speichern darf. Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Datum, Unterschrift

Die Agenda des Tages:

09:15 Registrierung
09:30 Begrüßung und Einleitung

09:45 Anwendungsbeispiele:
Warum High End Analysis?
10:15 Vorstellung der Methode ToF-SIMS
Vorstellung der Methode XPS
Vorstellung der Methode AES

11:15 Kaffeepause

11:30 Anwendungen Auger Elektronen Spektroskopie
12:00 Mittagessen (Buffet)

13:00 Praktischer Teil (3 Gruppen á 20 min)
ToF-SIMS; XPS; AES

14:00 ToF-SIMS für die Produktanalyse bei der On-Surface-Photopolymerisation" in Ordnung – **Prof. Dr. Markus Lackinger (TU München)**

14:30 Vorstellung Timegated Raman Spectroscopy

15:00 Kaffeepause

15:20 Die Neuesten Entwicklungen im Bereich Oberflächenanalytik: XPS Optionen: UPS, LEIPS & REELS; Methoden: HAXPES/XPS und TOF-SIMS mit Parallel Tandem MS

15:55 Zusammenfassung:
Testmessungsgutschein & Feedback

16:00 Kaffeepause + Möglichkeit zur Diskussion Ihrer individuellen Fragestellung

16:30 Ende des Seminars

Unter Vorbehalt eventuell Änderungen, diese werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Zielsetzung:

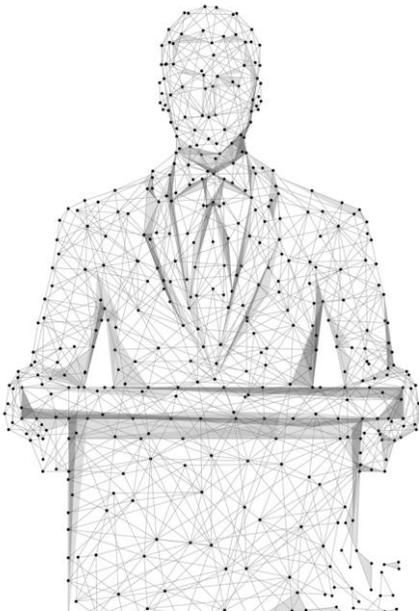
Dieses Seminar vermittelt Ihnen durch eine interdisziplinäre Herangehensweise einen Überblick über die wichtigsten oberflächenanalytischen Methoden und gibt Ihnen ein Verständnis für deren Anwendung.

Typische Fragestellung:

- Wie bewerten Sie als Experte das Alterungsverhalten von Beschichtungen?
- Haben Optimierungen und Maßnahmen funktioniert?

Das Seminar stellt Ihnen analytische Nachweisverfahren für die Untersuchung von Nanoschichten oder zur Fehleranalytik und Qualitätskontrolle, vor.

Freuen Sie sich auf die Vorstellung der neuesten Geräteentwicklungen, in der Oberflächenanalytik! Unser Seminar, genau das Richtige für Sie.



Kontaktinformationen:

Anmeldung zum kostenlosen Seminar inklusive Testmessungs-Gutschein für Neukunden, Verpflegung während des Seminars sowie Unterlagen zum Themengebiet. Ihre Anmeldung richten Sie bitte per E-Mail, auf dem Postweg bzw. per Telefon oder Fax an:

Physical Electronics GmbH

z. Hd. Stefanie Zauzig

Salzstraße 8

D-85622 Feldkirchen bei München

TEL. +49/89/96 275-0

FAX +49/89/96 275-50

Email szauzig@phi-europe.com

URL www.phi-gmbh.eu

Auch bei sonstigen Fragen zum Seminar steht Ihnen Frau Zauzig gerne zur Verfügung. Die Teilnehmerzahl ist auf 24 Personen begrenzt, darum bitten wir Sie, sich rechtzeitig anzumelden. Sie können leider nicht teilnehmen? Gerne senden wir Ihnen Informationsmaterial über alternative Termine zu.



PHYSICAL ELECTRONICS GMBH

XPS (Röntgenphotoelektronenspektroskopie)



TOF-SIMS (Sekundärionenmassenspektrometrie)



AES (Augerelektronenspektroskopie)

